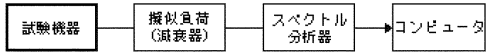
九　副次的に発する電波等の限度

第一の九の項に同じ。

九　副次的に発する電波等の限度

1　測定系統図



2　測定器の条件

⑴　擬似負荷（減衰器）の減衰量は、副次的に発する電波がスペクトル分析器の雑音の影響を受けない値とする。

⑵　探索時のスペクトル分析器を次のように設定する。

掃引周波数幅	30MHzから３GHzまで
分解能帯域幅	測定周波数が30MHzを超え１GHz以下の場合は100kHz、１GHzを超える場合は１MHz
ビデオ帯域幅	分解能帯域幅と同程度
掃引時間	測定精度が保証される最小時間
掃引モード	単掃引
検波モード	ポジティブピーク

⑶　レベル測定時のスペクトル分析器を次のように設定する。

中心周波数	⑵で探索した周波数
掃引周波数	０Hz
分解能帯域幅	測定周波数が30MHzを超え１GHz以下の場合は100kHz、１GHzを超える場合は１MHz
ビデオ帯域幅	分解能帯域幅と同程度
掃引時間	測定精度が保証される最小時間
掃引モード	単掃引
検波モード	サンプル

3　試験機器の状態

試験周波数に設定し、受信状態とする。

4　測定操作手順

⑴　スペクトル分析器を２⑵のように設定して掃引し、副次発射の振幅の最大値を探索する。

⑵　探索した結果が設備規則に規定する許容値の１／10以下の場合は、探索値を測定値とする。

⑶　探索した結果が設備規則に規定する許容値の１／10を超えた場合は、スペクトル分析器の中心周波数の設定精度を高めるために周波数掃引幅を順次狭くして、副次発射の周波数を測定し、スペクトル分析器を２⑶のように設定し、平均化処理を行って平均電力（バースト波の場合は、バースト内の平均値）を測定する。

5　試験結果の記載方法

⑴　設備規則に規定する許容値の１／10以下の場合は、最大の１波を周波数とともにnW又はpW単位で記載する。

⑵　設備規則に規定する許容値の１／10を超える場合は、すべての測定値を周波数とともにnW単位で記載し、かつ、電力の合計値をnW単位で記載する。

6　その他

⑴　擬似負荷（減衰器）は、特性インピーダンス50Ωの減衰器を接続して行うこととする。

⑵　測定系を含めてスペクトル分析器の感度が足りない場合は、信号と雑音の適切な比を確保するために低雑音増幅器を使用する。